

**WORKSHOP:****Spektroskopische Ellipsometrie****Anwendungsbeispiele für  
Ellipsometersoftware SpectraRay/4  
von SENTECH**

am Mittwoch, den 07. November 2018  
in Berlin-Adlershof

**Veranstalter:**

**SENTECH Gesellschaft für Sensortechnik mbH**  
Konrad-Zuse-Bogen 13, 82152 Krailling

**Veranstaltungsort:**

**SENTECH Instruments GmbH**  
Schwarzschildstr. 2, 12489 Berlin-Adlershof

**Workshop-Programm**

- 9:00 **Begrüßung / Vorstellung des Programms**
- 9:15 **Einführung in SpectraRay/4 – SENTECH Software für spektroskopische Ellipsometrie**  
Georg Dittmar, SENTECH Instruments GmbH, Berlin
- 10:45 **Einfache Modellierung komplexer Strukturen in SpectraRay/4 am Beispiel der Analyse von Multischichtsystemen auf transparenten und absorbierenden Substraten**  
Johanna Reck, SENTECH Instruments GmbH, Berlin
- 11:30 **Demonstration am SENresearch 4.0 in kleinen Gruppen**  
Sven Peters / Adrian Blümich, SENTECH Instruments GmbH, Berlin
- 12:30 **Mittagessen und Diskussion**
- 13:30 **Analyse optisch anisotroper Materialien und periodisch strukturierter Schichten (Scatterometry) – Anwendung der SpectraRay/4 Softwaremodule für Anisotropie und 3D Profiling**  
Sven Peters, SENTECH Instruments GmbH, Berlin
- 14:30 **Einführung in die Skriptsprache von SpectraRay/4**  
Uwe Richter, SENTECH Instruments GmbH, Berlin
- 15:00 **Anwendung der Skriptsprache für Multiexperimente in SpectraRay/4 – Beispiel: Analyse dünner metallischer Schichten mittels simultaner Auswertung von Ellipsometrie und Transmission**  
Adrian Blümich, SENTECH Instruments GmbH, Berlin
- 15:45 **Demonstration am SENresearch 4.0 in kleinen Gruppen**  
Sven Peters / Adrian Blümich, SENTECH Instruments GmbH, Berlin
- 16:45 **Netzwerken**
- Gleichzeitig können eigene Proben zusammen mit unseren Applikationsingenieuren vermessen werden.**
- Ende des Workshops**